

テストデータ解析ツール PC-FIRMS

超低価格

PC-FIRMS は超低価格で、高性能なキャラクタリゼーション、歩留り検証、ウエハ解析を行う半導体テストデータ向け検証ツールです。

容易に使用

PC-FIRMS は、ベーシックなキャラクタリゼーションと歩留り検証を高速かつ容易に行うためのシンプルなポイント・クリック・インターフェースを提供します。

バーチャル・リテスト

PC-FIRMS は、テスト許容範囲を設定しテスト・フロアへウエハ/パーツをリターンする必要なく、ロットを再テストすることが可能です。

パワフルなツール

FIRMS APIは、Perl, Jscript の他に VBScript インタープリタが含まれており、高度な検証の為にカスタマイズ可能なツールを提供します。

スタンド・アローン

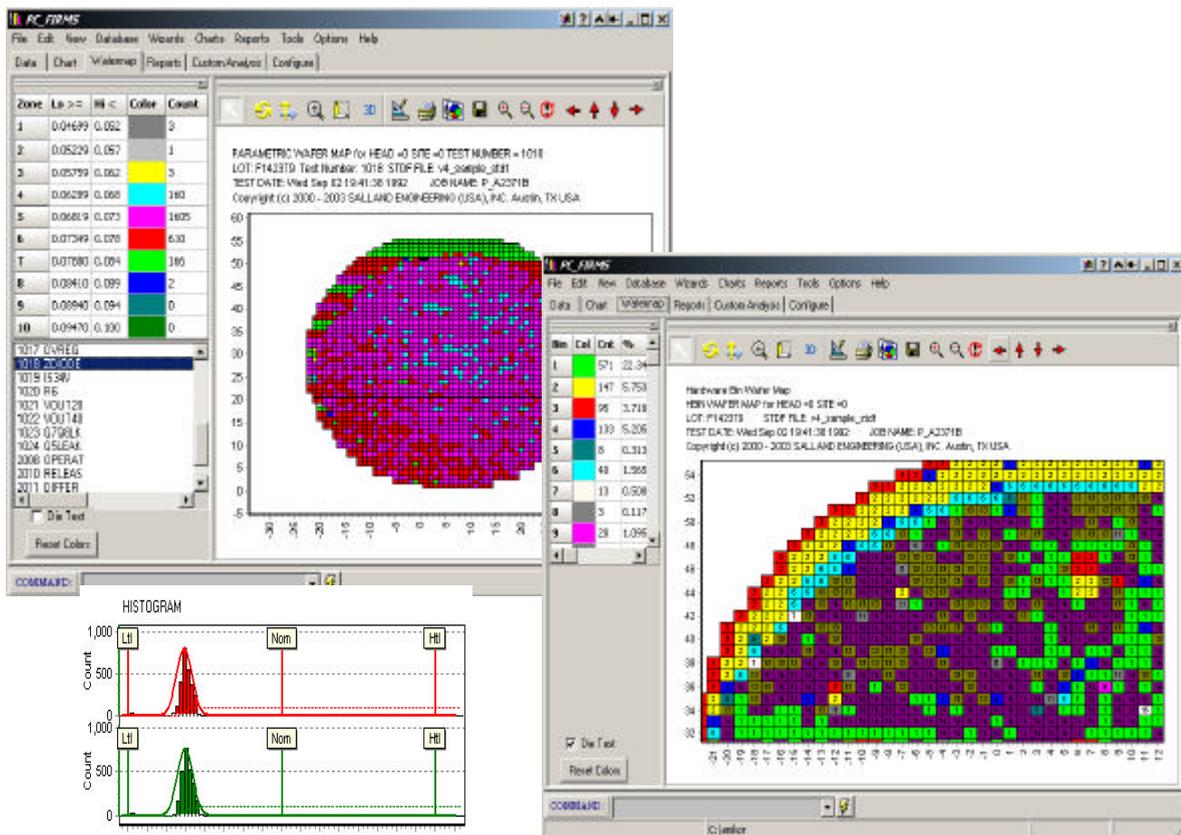
PC-FIRMS は、サードパーティのソフトウェアを必要としません。

フレキシブル

ユーザ環境で測定を行う場合も PC-FIRMS で検証することが可能です。

PC-FIRMS は、FIRMS サーバへ接続する FIRMS クライアント、FYI と製造エリアのモニタリング・プログラムも含まれます。

これらのツールは、パワフルで、超低価格、幅広いデータ・コレクション及び検証ソリューションです。





テストデータ解析ツール PC-FIRMS

全般

- ・半導体データの先進の解析機能
- ・コンフィギュラブルなユーザ制限でのバーチャルな再テスト
- ・passing/failing die, 連結によりマルチプル STDF ファイルを1つにマージ
- ・Correlation
- ・キャラクタリゼーション
- ・ゲージ・リピータビリティ& 再製造
- ・APIを使用したSQL, PERL, VBScript, Jscript での自動化、カスタマイズ
- ・マウスを使用した die レベルでのコンフィギュラブル、インタラクティブなウエーハ・マッピング
- ・テスト温度, テスト・サイト, 環境, ファクトリ, パーソナル, 等のファイルのグループデータ
- ・Bin による Include/Exclude データ, Pass/Fail, part id, result ranges, 等.
- ・STDF エディタに似たスプレッドシート
- ・Excel, HTML, PDF, STDF 等へエクスポート
- ・Win9x, WinNT, Win2000, WinXP サポート
- ・データ、レポート及びチャートを含んだアーカイブのワークスペースを通した作業の統合
- ・スタンドアローン又は FIRMS Data Pipeline Server で動作
- ・オンライン、検索、HTML ベースのヘルプ

入力ファイル・フォーマット

- ・Standard Test Data Format (STDF) Version 4
- ・ASCII Test Data Format (ATDF) Version 2
- ・マルチプル CSV (Comma Separated Values)formats
- ・Agilent STDF
- ・Reedholm .eTest
- ・Eagle
- ・Roos

- ・インポートウィザードを使用した ASCII フォームの生成を提供
- ・独自のユーザ向けカスタム・コンバータ & ローダ提供

出力ファイル・フォーマット

- ・マイクロソフト社 Excel
- ・STDF Version 4
- ・CSV (Comma Separated Values)
- ・HTML
- ・PDF
- ・ASCII
- ・プリンタへの出力
- ・クリックボードへのコピー

Outlier 除去手法

- ・IQR
- ・Grubbs
- ・+/- Standard Deviation * factor
- ・+/- Test Limits * factor
- ・Test Value Range

Include / Exclude Parts

- ・Hardware/Software Bins
- ・Test Value Range
- ・Part id
- ・Test Number/Name
- ・Test Head/Site

チャート& レポート

Paretos:

- ・Hardware/Software Bin Pareto
- ・Cp/Cpk Pareto
- ・Yield Pareto
- ・Fail Count Pareto
- ・Test Time Pareto
- ・Sigma Pareto
- ・Mean Pareto
- ・% Repeatability

ワークスペース・トレンド:

- ・Cp/Cpk Trend
- ・Mean Trend
- ・Sigma Trend

・Yield Trend

ウエハ・マップ:

- ・ハードウェア/ソフトウェア Bin
- ・Pass/Fail
- ・パラメトリック

キャラクタリゼーション:

- ・Histogram
- ・Parametric Trend
- ・Box Plot
- ・Mean Study

Correlation :

- ・X-Y Scatter
- ・Linear Correlation
- ・Test vs. Part ID

レポートの自動化 :

- ・Process Portrait
- ・N- Histogram
- ・ProcessCapabilityStudy Cp/Cpk
- ・Cpl/Cpu/Cpm
- ・Max/Min
- ・Mean/Median/Sigma
- ・統計相違調査
- ・T Test
- ・F Test
- ・1/Cpk Delta
- ・1/Cp Delta
- ・ゲージ R & R
- ・% リピータビリティ
- ・% リピータビリティ
- ・% Delta Max
- ・% Delta Min
- ・% Delta Mean
- ・% Delta Sigma

ASCII レポート :

- ・Lot/Merged Summary
- ・Lot/Merged Synopsis
- ・Lot/Merged Virtual Retest
- ・Production Summary
- ・Datalog
- ・タブラ・レポート

株式会社アイヴィス

240-0005 横浜市保土ヶ谷区神戸町134 横浜ビジネスパークイーストタワー11F

TEL:(045)332-5381(代) FAX:(045)332-5391 <http://www.i-vis.co.jp> email: info@i-vis.co.jp

